МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ)

Институт информационных технологий, математики и механики

Отчет по лабораторной работе №1: «Реализация метода обратного распространения ошибки для двуслойной полностью связанной нейронной сети»

Выполнил: студент группы 381603м4 Герасимов Дмитрий Михайлович

Проверила:

к.т.н., старший преподаватель кафедры МОСТ Кустикова В. Д.

Нижний Новгород 2017

Содержание

Постановка задачи	3
Вывод формул для метода обратного распространения ошибки	
Программная реализация	
Результаты экспериментов	
Литература	

Постановка задачи

Выполнение лабораторной работы предполагает решение следующих задач:

- 1. Изучить общую схему метода обратного распространения ошибки;
- 2. Вывести формулы для вычисления градиентов функции ошибки по параметрам нейронной сети и формул коррекции весов;
- 3. Разработать программную реализацию;
- 4. Получить результаты для разработанной двухслойной полносвязной нейронной сети, которые соотносятся с результатами на официальной странице набора данных MNIST.

Вывод формул для метода обратного распространения ошибки

Пусть введены следующие обозначения:

N — количество входных нейронов;

M – количество выходных нейронов;

K — количество нейронов на скрытом слое;

L – количество обучающих примеров.

Функция кросс-энтропии расмматривается в качестве функции ошибки:

$$E(w) = \frac{-1}{L} \sum_{k=1}^{L} \sum_{j=1}^{M} y_{j}^{k} * \ln(u_{j}^{k})$$
 , $y_{j}^{k} = 1 \Leftrightarrow x_{k} \in j$ классу.

Здесь $y^k = (y^k_j) \in Y$, (j=1,...,M) . В свою очередь Y - это множество обучающих примеров. $u^k = (u^k_j)$ - выход нейронной сети полученный для $x^k = (x^k_i) \in X$, (i=1,...,N) .

В последовательном режиме (также его еще называют стохоастический) корректировка весов выполняется после каждого примера обучающей выборки. Пусть $x=(x_1,x_2,...,x_N)$, $y=(y_1,y_2,...,y_M)$ и $u=(u_1,u_2,...,u_M)$ - конкретный обучающий пример. Тогда получаем, что $E(w)=-\sum_{i=1}^M y_i*\ln(y_i)$.

Если обозначить веса синапсических связей от входных нейронов к нейронам скрытого слоя как $w_{is}^{(1)}$, а от нейронов скрытого слоя к выходным нейронам как $w_{si}^{(2)}$, то f_s записывается в виде:

$$f_s = \sum_{i=0}^{N} w_{is}^{(1)} * x_i$$
, $s = 0,...,k$ - взвешенная сумма входных сигналов.

Как функцию активации на последнем слое берут функцию softmax :

$$u_j = \sum_{m=1}^M \frac{e^{g_j}}{e^{g_m}}$$
 , где $g_j = \sum_{s=0}^K w_{sj}^{(2)} * v_s$ ($j = 1,...,M$).

Таким образом E(w) можно представить как:

$$E(w) = -\sum_{j=1}^{M} y_{j} * \ln(\frac{e^{g_{j}}}{\sum_{m=1}^{M} e^{g_{m}}}) = -\sum_{j=1}^{M} y_{j} * (g_{j} - \ln(\sum_{m=1}^{M} e^{g_{j}})) ,$$

где g_i вычисляется по формуле:

$$g_j = \sum_{s=0}^K w_{sj}^{(2)} * \phi \left(\sum_{i=0}^N w_{is}^{(1)} x_i \right) .$$

Задача оптимизации функции ошибки по всем синапсическим весам есть задача обучения нейронной сети:

$$E(w) \rightarrow min_w$$
.

В методе обратного распространения ошибки параметры сети выбираются с использованием градиентных методов оптимизации. Стоит заметить, что если функция активация на скрытом слое – это $\tanh(x)$, т.е. $\phi(f_s) = \tanh(f_s)$. Тогда градиент имеет следующую структуру:

$$\frac{\delta E(w)}{\delta w_{sj}^{(2)}} = \delta_j^{(2)} * v_s , \frac{\delta E(w)}{\delta w_{is}^{(1)}} = \delta_s^{(1)} * x_i .$$

На каждом шаге r+1 обучения сети производится коррекция весов по формулам (η - скорость обучения):

$$w_{is}^{(1)(r+1)} = w_{is}^{(1)(r)} - \eta \frac{\delta E(w)}{\delta w_{is}^{(1)}}, \quad w_{sj}^{(2)(r+1)} = w_{sj}^{(2)(r)} - \eta \frac{\delta E(w)}{\delta w_{sj}^{(2)}}.$$

Программная реализация

Алгоритм обучения нейронной сети, описываемый в настоящей лабораторной работе, можно представить как последовательность следующих шагов:

- 1. Перед началом обучения веса нейронной сети *w* инициализируются случайным образом;
- 2. for epoch = 1,.., number Of Epochs;
- 3. for i=1,...,W*H, где W ширина изображения в пикселах и H высота изображения в пикселах;
- 4. Следует прямой проход и обратный проход (алгоритмы описаны ниже);
- 5. Шаги 3-4 повторяются до тех пор пока не будет достигнута достаточная точность, то есть $E(w_{cur})$
 CrossEntropyError или заданное количество итераций метода numberOfEpochs было достигнуто.

Прямой проход можно представить как:

$$x_i \rightarrow v_s$$
, $\partial \phi / \partial f_s \rightarrow u_j$

То есть вычисляются значения выходного сигналов нейронов скрытого слоя v_s , $s\!=\!0,...,K$ (где K — количество нейронов на скрытом слое) и значение производной функции активации на скрытом слое $\left.\begin{array}{c} \partial \phi \\ \partial f_s \end{array}\right.$. Затем вычисляются значения сигналов выходного поля u_j , $j\!=\!1,...,M$ (где M — количество классов изображений).

Обратный проход:

for
$$j=1,...,M$$

$$\partial_{j}^{(2)}=u_{j}-y_{j},$$

$$\partial E(w)/\partial w_{sj}^{(2)}=\delta_{j}^{(2)}*v_{s},$$

for
$$s=0,...,K$$

$$\partial_{s}^{(1)} = \frac{-\delta \phi}{\delta f_{s}} \sum_{j=1}^{M} \delta_{j}^{(2)} * w_{sj}^{2} ,$$

$$\frac{\partial E(w)}{\partial w_{es}^{(1)}} = \delta_{s}^{(1)} * x_{i} ,$$

for для каждой дуги:

$$w_{is}^{(1)} = w_{is}^{(1)} - \eta \frac{\partial E(w)}{\partial w_{is}^{(1)}},$$

$$w_{sj}^{(2)} = w_{sj}^{(2)} - \eta \frac{\partial E(w)}{\partial w_{sj}^{(2)}}.$$

Результаты экспериментов

Точность классификации объектов из набора данных MNIST была рассчитана по следующей формуле:

$$p = \frac{true}{true + false}$$

где *true* — количество правильно определённых цифр, *false* — количество неправильно определённых цифр.

Для получения сводной таблицы величина целевой функции была зафиксирована значением 7.0e-3. Значения заданные для остальных параметров нейронной сети представлены в таблице ниже вместе с результатами экспериментов.

Количество нейронов в	Скорость обучения	Пройденное количество	Ошибка классификации	Ошибка классификации
скрытом слое		эпох до	на	на тестовом
		достижения	тренировочном	наборе
		заданной	наборе	
		точности		
100	5.0e-3	21	4.0e-4	2.18e-2
100	7.0e-3	17	3.33e-4	2.09e-2
200	5.0e-3	19	4.5e-4	1.91e-2
200	7.0e-3	16	5.5e-4	1.84e-2
300	4.0e-3	22	4.16e-4	1.91e-2
300	8.0e-3	14	8.8e-4	1.82e-2

Литература

- 1. MNIST dataset [http://yann.lecun.com/exdb/mnist].
- 2. OpenCV [http://opencv.org].
- 3. Материалы Летней межвузовской школы 2016 [https://github.com/itseez-academy/itseez-ss-2016-theory], [https://github.com/itseez-academy/itseez-ss-2016-practice].